



中華民國專利證書

發明第 I768756 號

發明名稱：熱導元件內部空隙率的量測系統與其量測方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：孫珍理、劉昱祥、連于仁

專利權期間：自 2022 年 6 月 21 日至 2041 年 3 月 9 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國



年 6 月 21 日

